

摂動特徴量による顔画像に対する形状モデルフィッティング

木下 航一^{†a)} 小西 嘉典[†] 勞 世竑[†] 川出 雅人[†] 村瀬 $\stackrel{\dagger^{\dagger}}{}$

Perturbation Feature and It's Apprication to Shape Model Fitting for Facial Images

Koichi KINOSHITA^{†a)}, Yoshinori KONISHI[†], Shihong LAO[†], Masato KAWADE[†], and Hiroshi MUSASE^{††}

あらまし 顔画像に対して,高速で高精度に形状モデルフィッティングを行う手法を提案する.形状モデルの フィッティング手法は多数提案されているが,顔画像に対するフィッティングは影や表情変化などのノイズの影 響を受けやすく,高精度な結果が得られにくいという課題があった.また多数の繰返し演算を必要とするため, リアルタイム処理の実現は難しかった.我々はこれらの課題に対して(1)形状モデル上でのサンプリング点の 構造的配置(2)特徴量による形状パラメータの摂動量推定,を行うフィッティング手法を提案する(1)によっ てノイズの影響を受けにくい局所特徴量を有効に活用でき,影や表情変化などに対する頑健性が向上する.また (2)によって特徴量から一度の行列演算で形状パラメータの修正量を求めることが可能となり,処理時間が削減 できる.公開データベースによる実験の結果,従来手法と比較して約20倍の高速化を実現しつつ,影や表情変 化などのノイズのある顔画像に対して従来手法を上回る検出性能を示した.

キーワード 特徴量, 顔画像, 特徴点検出, 形状モデル

1. まえがき

顔画像上から,目や鼻,口の端点等の位置を検出す る技術は一般に顔特徴点検出(Facial Feature Detection)あるいは顔器官検出(Facial Parts Detection) などと呼ばれ,顔認証,表情推定などの顔画像処理 を実現する上で重要な役割を担っている.しかしその 重要性にもかかわらず,リアルタイム処理が可能で, 様々な撮影条件(例えば影や表情変化など)に対して 頑健な性能をもつ,実用的な手法は報告されていない.

顔特徴点位置の正確な検出には,個々の特徴点周り の局所的な情報と,それら特徴点配置に関する大域的 な情報を適切に組み合わせて利用することが重要で あると考えられている[3].この観点から成功を収め

^{††} 名古屋大学大学院情報科学研究科,名古屋市 Graduate School of Information Science, Nagoya University, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi, 460–3807 Japan

a) E-mail: kino@ari.ncl.omron.co.jp

た手法は、Cootes ら [1], [2] の Active Shape Model (ASM)とActive Appearance Model(AAM)であ ろう.これらの手法は、顔特徴点配置を形状モデル (Shape Model)と呼ばれるモデルで表現する.形状 モデルとは、特徴点配置の座標集合に対して主成分分 析を適用し、これによって得られた基底ベクトルのう ち固有値の大きなものだけで、座標表現を再構成した ものである.形状モデルを用いることにより特徴点分 布が低次元で表現可能になる.このことは、データ量 の圧縮だけでなく、検出結果が顏らしい形状を保つよ うな優れた拘束条件として有効に活用される.

両者ともに顔特徴点検出技術として活用可能であり, これらを基礎とした改良手法が近年多数提案されてい る.しかしながら,形状モデルを顔画像上に適合させ る処理(フィッティング)には多数の繰返し計算が必 要になり,リアルタイム処理は難しい.また照明によ る影や表情変化を含む顔画像に対してのフィッティン グ性能は大幅に低下することが多く,これらの課題は, これまで提案された改良手法でも解決されていない. 例えば ASM を基礎にした手法として STASM [8]

[†] オムロン株式会社技術本部,木津川市 Research & Development HQ, Omron Corporation, 9-1 Kizugawadai, Kizugawa-shi, 619-0283 Japan

を例にとると,この手法では特徴量として多重解像度 画像における法線方向輝度パターンを用いることに よって,フィッティングの精度向上が図られている.し かしながら影や表情変化時の検出精度には依然大きな 低下が見られ,また特徴点探索や形状モデルの修正に 多数の繰返し計算を必要とするため,処理時間の面で も課題が大きい.

本論文では,これら二つの問題に対して,以下二つ の特徴をもつ新たな形状モデルフィッティング手法を 提案する.

(1) 形状モデル上でのサンプリング点の構造的配置

照明変動による影,表情変化によるしわなどは特徴 量に対してノイズとなり,フィッティングの性能を低下 させる要因となる.特徴点から離れた(もともとはっ きりした特徴のない)領域においては,こういった変 動は支配的な影響をもたらすが,もともとはっきりと した特徴のある領域ではノイズの影響は相対的に弱く なる.したがって特徴点周辺の局所的情報は,影や表 情変化などに対して比較的頑健であり,フィッティン グの際重要な情報となる.提案するサンプリング手法 により,形状モデル全域を疎にカバーしながら,各特 徴点周辺の局所的な特徴に関しては密な情報をもつ特 徴量集合が得られる.これによって影や表情変化など のノイズに対して頑健なフィッティングが実現できる.

(2) 特徴量による形状パラメータの摂動量推定

正解位置からずれた状態の形状モデルの特徴量と, そのときのずれ量の関係を正準相関分析によって学習 する.この関係を利用することにより形状モデルのず れ状態(摂動状態)が特徴量から推定できる.これに よって特徴量から一度の行列演算で形状修正を行うこ とが可能となり,処理時間を削減できる.

提案する形状モデルフィッティング手法は以上二つ の処理によって,各ノード周りで一定の構造をもって サンプリングされた特徴量によって形状モデルを制 御する.そのため我々は,この形状モデル制御方法を Active Structured Appearance Model (ASAM)と 呼ぶ.

本論文では以下,2.において形状モデルについて概 説し,3.で(1)の特徴量サンプリング手法について 説明する.4.において(2)の原理となる特徴量によ る摂動状態推定について述べ,5.で(2)の形状パラ メータ推定手法について説明する.6.では実験結果を 示し,7.において考察を行う. 2. 顔形状モデル

顔特徴点配置は,適切な方法で移動,回転,縮小の操作を行って正規化した後,主成分分析(Principal Component Analysis: PCA)を用いることにより低次元で表現可能となる.今,ある特徴点の座標を $[x_m, y_m]$ とし,全特徴点の座標をまとめて $\hat{\mathbf{x}} = [x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_M, y_M]^T (\in \mathcal{R}^{2M})$ と書く. ここで M は特徴点の数である.また,ある顔画像 nについての特徴点座標を $\hat{\mathbf{x}}_n$ とし,正規化を行った後の特徴点座標を \mathbf{x}_n と表す.分散共分散行列 Σ は,

$$\boldsymbol{\Sigma} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} (\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}}) (\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}})^T$$
(1)

となる.N は顔画像の数である.任意の正規化特徴点 ベクトルは標準固有値問題,

$$\Sigma \Phi = \Phi \Lambda \quad (\Phi^{\mathrm{T}} \Phi = \mathbf{I}) \tag{2}$$

の解として得られる正規直交基底 Φ を用いて,以下 のように表せる.

$$\mathbf{x} \approx \bar{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{\Phi}} \tilde{\mathbf{b}}$$
 (3)

ここで, $\hat{\Phi}$ は上位 k 個の固有値に対応する固有ベクト ルから構成した基底ベクトル, \hat{b} はそれに対応するパ ラメータベクトルである.したがって,元画像上の特 徴点座標は,

$$\hat{\mathbf{x}} \approx F(t_x, t_y, t_\theta, t_s, \mathbf{b})$$
$$= F(\mathbf{p}) \tag{4}$$

として相似変換パラメータと基底ベクトルに関するパ ラメータの関数として近似的に表現することが可能で ある.ただし, $\mathbf{p}^T = [t_x, t_y, t_\theta, t_s \mid \tilde{\mathbf{b}}^T]$ である.ここ で,相似変換に関するパラメータを "Pose パラメー タ",基底ベクトルにかかるパラメータを "Shape パ ラメータ"と呼ぶ.

3. 構造的レティナサンプリング

ASM に基礎を置く手法においては,特徴量は輪郭 の法線方向の1次元上でサンプリングされることが多 い.このような特徴量は比較的低次元であるため情報 量が少なく,信頼性のある局所情報とはいえない.そ のため影や表情変化による顔のしわなどのノイズに影響されて良い性能を得にくいという課題があった.





(b)

- 図 1 (a) 形状モデルの例, (b) 対応するサンプリング点 配署
- Fig. 1 (a) Shape model. (b) Corresponding sampling points.

一方 AAM に基礎を置くアピアランスベースのモデ ルフィッティング手法においては,特徴量サンプリン グは平均形状に変換したモデル上で均一に行われるこ とが一般的である(例えば[12]). そのため特徴量は 高次元となり,また形状変換のための演算が必要とな り高速な処理は難しかった.更に得られた特徴量は, モデルの摂動に対して変化が少なく,必ずしもフィッ ティングに有効でない(例えば頬や額の部分など)領 域を多く含んでいるため,ノイズによる悪影響を受け やすいという課題があった.

このような課題に対応するため,我々は形状モデル の各ノード周りに放射状にサンプリング点を配置する サンプリング手法を導入する.

特徴点の周りに放射状にサンプリング点を配置する 手法は, Smeraldi ら [4] によって考案され, 特徴点検 出に対して有効であることが示されている.ただし彼 らはこの点配置を各特徴点に対して独立に適用し,形 状モデルと関連づけて利用されることはなかった.

顔特徴点周辺の局所的情報は,影や表情変化などに 対して比較的頑健であり,フィッティングの際重要な情 報となる.提案する手法は顔全域を疎にカバーしなが ら,各特徴点周りでは密な特徴量サンプリングを行う. これにより比較的低次元で,ノイズに頑健な,フィッ ティングに有効な局所情報を顔全域から抽出すること ができる.

ここでこの手法を,構造的レティナサンプリング (Structural Retinotopic Sampling)と呼ぶ、図1に 形状モデルの例と,この上でのサンプリング点配置の 例を示す.

本論文では,形状パラメータpのとき,上記方法に より画像から特徴量fを取得するサンプリング操作を

 $\mathbf{f} = \mathcal{S}(\mathbf{p})$ (5) と表記する.

4. 特徴量による摂動状態の推定

特徴点検出において特徴量サンプリングは、そのサ ンプリング位置(あるいは角度,大きさ)が正解か不 正解かを判別する目的で行われるのが一般的である (例えば[4]). 例えば目の位置検出であれば, 事前に正 解とされる目の位置においてサンプリングした特徴量 と,それ以外の不正解とされる場所でサンプリングし た特徴量によって識別器を学習しておき,位置を変え ながら逐次サンプリングを行って正解・不正解を判定 する.したがって正解位置に到達するまでに多数の繰 返し計算が必要となる.

これに対して我々は,特徴量から,その特徴量がサ ンプリングされた位置の正解点に対する相対位置を推 定する手法を提案する.これによって正解位置までの 移動量が推定できるため、探索処理が大幅に削減可能 となる.

なお本章では説明の簡略化のため,特徴点一点の位 置に着目して摂動状態推定の原理説明を行う.その後, 5. において本原理を用いた形状モデルの摂動状態推定 について説明を行う.

4.1 摂動特徴量

ここでは単純な場合を例にとり, サンプリングされ た特徴量から摂動状態を推定可能であることを示す. 図 2(a) にサンプリング点配置の例を示す.サンプリ ング点は十字に配置された5点とし,1画素ずつ間隔 を空けて配置されているものとする.数字はサンプリ ング点の番号を示す.図2(a)下図は,このサンプリ ング点を方形上に配置した状態を示す.画像は2値画 像とする.今,この状態を基準位置として,サンプリ ング点配置が上下左右に摂動した状態でサンプリング を行う.図2(b)に摂動ベクトルと,各状態でサンプ リングした特徴量を示す.例えば,Lを例にとると基 準位置から1画素左にサンプリング位置が移動するこ とにより,1,2,3,5のサンプリング点は方形から外 れ,4のみが方形の画素と重なる.図2(c)はこれら の特徴量について, 3, 4, 5 の 3 点の状態について特 徴量空間にプロットしたものである(黒=1,白=0と する).

このように,特徴量は摂動状態によって特徴量空間 内で異なった位置を示す、そしてその位置は特徴量が サンプリングされた摂動状態を反映したものになる.

ここで,基準点から摂動させた状態で取得した特徴



- 図 2 (a) サンプリング点配置(上)と基準位置に配置し た状態(下),(b) 摂動ベクトル(上)と各摂動状態 での特徴量(下),(c) 特徴量空間.各軸は数字で示 したサンプリング点の状態を示す(黒=1,白=0)
- Fig. 2 (a) Sampling points and base position. (b) Perturbation vector and features at each perturbation. (c) Feature space. Each axis shows state of sampling point indicated by number.

量を摂動特徴量と呼ぶ.

4.2 摂動状態の推定

摂動特徴量に関してサンプリング点を十分多くとれ ば,位置・角度等の微妙な摂動を反映する低次元の特 徴量空間を得ることができる.このような空間は PCA によって求めることができる.

今,あるサンプリング点配置で取得した特徴量を f_p と表す.ある特徴点を基準としてサンプリング位置を 摂動させて特徴量 f_1, \dots, f_P を得たとき,この平均ベ クトルを \bar{f} とすると,この特徴量分布の分散共分散行 列 Σ は,

$$\boldsymbol{\Sigma} = \frac{1}{P} \sum_{p=1}^{P} (\mathbf{f}_p - \bar{\mathbf{f}}) (\mathbf{f}_p - \bar{\mathbf{f}})^T$$
(6)

となる. P は摂動サンプリングの数である. これに対 する標準固有値問題,

$$\Sigma \Phi = \Phi \Lambda \quad (\Phi^{\mathrm{T}} \Phi = \mathbf{I}) \tag{7}$$

を解くことによって,この空間の正規直交基底 Φ が 得られる.このとき上位 k 個の固有値に対応する少数 の固有ベクトルのみから構成した基底ベクトル $\tilde{\Phi}$ は, サンプリング時の摂動による特徴量変化を反映した部 分空間となる.いったんこの空間が求まれば,サンプ リングされた特徴量をこの空間に射影することで,摂 動状態の推定が可能となる.

図 3 にこの手法によって求めた部分空間の例を示す. 図 3 (a) は対象画像と,基準位置におけるサンプリング 点配置を示している.特徴量次元は 37 である.このと き,基準点を中心として $x, y = \pm 0.1R, \theta = \pm 30 \deg$ の範囲で一様乱数によってサンプリング点を摂動させ,



Fig. 3 (a) Test image and sampling points. (b) Feature space.

5000 個の特徴量を得た.ここでR は図 3 (a) に示した 方形の 1 辺の長さであり, θ はサンプリング点配置の 回転を表す.このようにして得られた特徴量集合に対 して,上記の手続きにより部分空間を求めた.次に,各 摂動状態での特徴量が部分空間内でどのように分布し ているのかを知るため,基準点を中心とする半径 0.1Rの円周上の各位置 ($\phi = 0, 10, 20, \cdots, 350 \deg$)で同 一の点配置による特徴量サンプリングを行い ($\theta = 0$ に固定),これを部分空間に射影した.図 3 (b) にこ の結果を示す.横軸は第1主成分,縦軸は第2主成分 に相当し,図中の ϕ は,サンプリング位置を示してい る.サンプリング時の摂動状態が,空間内での位置に 反映されていることが確認できる.

4.3 顔画像における摂動特徴量

摂動特徴量の部分空間を用いることにより,特徴量から摂動状態を推定可能であることを,顔画像を用いた実験により説明する.図4(a)に実験に用いた顔画像の例と,サンプリング点配置を示す.基準位置は右目の顔中央側端点とした.

このサンプリング点配置にランダムな移動,回転, 拡大縮小を加え,意図的に摂動状態での特徴量を得る. 200名の顔画像について,1人当り5回,計1000個の 特徴量を得た.なお摂動の範囲は移動については両目 間隔の20%以内,回転については±30 deg以内,拡 大縮小については0.5~1.5倍の範囲とした.またこの 実験では特徴量は画素の輝度値とした.この特徴量分 布に対して上述の手続きを行い部分空間を得た.

図 4 (b) は, 上記 200 名とは別の 100 名の顔画像に ついて,基準位置から顔の中央寄り,外側寄りにそれ ぞれ水平に両目間隔の 20%移動した点でサンプリング した特徴量を,第1主軸と第2主軸で張られる空間に



Fig. 4 (a) Sampling points. (b), (c) Feature vector plots on the feature space.

射影しプロットしたものである.また図 4(c) は同様 に+30 deg,-30 deg 回転させた配置での特徴量を第 2,第3 主軸で張られる空間に射影したものである.特 徴量は基準位置からの摂動方向によって空間内で明確 に分離していることが分かる.したがって本実験につ いて,特徴量の部分空間内での位置より,摂動方向と その距離を推定できることが分かる.このことは,摂 動特徴量の部分空間を用いることにより,摂動状態を 推定可能であることを示唆する結果であるといえる.

5. 形状モデルの摂動状態推定

前章においては各特徴点を独立に取り扱ったが,形 状モデル全体について特徴量と形状モデルパラメー タの摂動状態を関連づけて学習することで,形状モデ ルの摂動量を直接推定することが可能である.これに よって形状モデルがどれだけ正解形状からずれている かの推定ができ,大幅な形状修正による高速なフィッ ティングが実現できる.

特徴量と形状モデルパラメータはどちらも多次元で あるため,両者の相関関係の推定には多次元変量の回 帰学習手法が必要となる.ここではその一種である正 準相関分析(Canonical Correlation Analysis: CCA) によってこれを行う.

以下, CCA について概説した後,提案する学習手順とフィッティング手順について述べる.

5.1 正準相関分析

p次元の変量ベクトル $\mathbf{x} = [x_1, \cdots, x_p]^T \ge q$ 次元 の変量ベクトル $\mathbf{y} = [y_1, \cdots, y_q]^T$ があるとき,この 同時分布を考え,その分散共分散行列を

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{XX} & \boldsymbol{\Sigma}_{XY} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{YX} & \boldsymbol{\Sigma}_{YY} \end{bmatrix}$$
(8)

とする.これらの変量ベクトルの任意の線形結合に

よって生成される新変量

$$u = \mathbf{a}^T \mathbf{x}, \quad v = \mathbf{b}^T \mathbf{y} \tag{9}$$

を考えたとき,両者の相関が最大になるような係数ベ クトル a,b を求める.そのためには共分散

$$Cov(u, v) = \mathbf{a}^T \boldsymbol{\Sigma}_{XY} \mathbf{b} \tag{10}$$

を最大にするような a,b を求めればよい.この問題は, 両者の分散を1に標準化し,ラグランジュの未定乗数 法を用いることで一般固有値問題を解く問題に帰着される.

今,この固有値問題を解いて得られた第i固有値に 対応する固有ベクトルを $\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_i$ と書く.p > qとし, 第q正準変量まで求めるとすれば,元の変量空間 \mathbf{x}, \mathbf{y} から新変量 \mathbf{u}, \mathbf{v} への変換はそれぞれ

$$\mathbf{u} = [\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_q]^T \mathbf{x}$$
$$= \mathbf{A}^T \mathbf{x}$$
(11)

$$\mathbf{v} = [\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_q]^T \mathbf{y}$$
$$= \mathbf{B}^T \mathbf{y}$$
(12)

となる. u から v への線形回帰式は,

$$\mathbf{v} = diag[\lambda_1, \cdots, \lambda_q]\mathbf{u}$$
$$= \mathbf{\Lambda}\mathbf{u}$$
(13)

で与えられる.以上より, $x \Rightarrow y$ の写像変換は

$$\mathbf{y} = \mathbf{G}\mathbf{x}$$
 (ただし, $\mathbf{G} = (\mathbf{B}^T)^{-1}\mathbf{\Lambda}\mathbf{A}^T$) (14)

のように表される.

5.2 学習手順

学習は以下の手順で行う.なお,学習画像にはあらかじめ特徴点の正解座標が入力されているものとする.

(1) i = 1, n = 1とする.

(2) n 枚目の顔画像に対して,式(3)の関係を用 い正解座標群をパラメータ空間に射影し,正解位置で のモデルパラメータ p_{fit}を求める.

(3) 乱数により摂動 $\Delta \mathbf{p}_i$ を加えたパラメータ $\mathbf{p}_{\text{err}} = \mathbf{p}_{\text{ft}} + \Delta \mathbf{p}_i$ をもつ摂動モデルを生成する.

(4) $\mathbf{f}_i = S(\mathbf{p}_{err})$ により特徴量を取得する.

(5) $i \Leftarrow i+1$

(6)(3)以降を R 回繰り返す. R は乱数の発生
回数.

(7)(2)以降をn = Nまで繰り返す(N は顔画



Fig. 5 Scatter plot of model parameter perturbation. (horizontal) ground truth, (vertical) estimated value.

像の枚数).

(8) Δpとfの同時分布を考え, CCA により変換行列 G を求める.

図5に,変換行列Gによるパラメータ摂動量の推定値と正解値との散布図の例を示す.各グラフとも横軸が正解摂動量,縦軸が推定摂動量であり,各図の下にそれぞれの相関値を示した.図より相関値はおおむね0.5以上の正の値を示しており,有効な変換行列が学習できていることが分かる.

なお図より,推定誤差のばらつきは摂動量によらず 一定となる傾向が見られる.これは学習を行った範囲 では,特徴量のもつばらつきが,摂動量の大きさにか かわらず一定であるためであると考えられる.

5.3 フィッティング手法

以上の学習によって,特徴量と摂動によるパラメー 夕誤差を関連づける変換行列が得られた.本節では, これを用いてフィッティングを行う手法について述べ る.なおここでは何らかの顔検出手段により既に画像 上での顔位置は検出できているものとする.

(1) $i = 1 \ \mathcal{E} \mathbf{b}$, $\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{\text{init}} \ \mathcal{E}$ する(例えば $\mathbf{p}_{\text{init}} = [\hat{t}_x, \hat{t}_y, \hat{t}_\theta, \hat{t}_s \mid \mathbf{0}^T]^T$, $\hat{t}_x, \hat{t}_y, \hat{t}_\theta$ は顔検出によっ て求まった顔中心座標と顔の傾き, \hat{t}_s は顔の大きさに 応じた平均的な値).

(2) $\mathbf{f}_i = S(\mathbf{p}_i)$ により特徴量を取得する.

(3) 変換行列 G と式 (14) より誤差の推定値 $\Delta \mathbf{p}_i$ を得る.

(4) $\mathbf{p}_{i+1} = \mathbf{p}_i - \delta \Delta \mathbf{p}_i$ によりパラメータの修正 を行う.

(5) $i \Leftarrow i+1$

(6)(2)以降を終了条件を満足するまで繰り返す. なお,終了条件としてはi > R(Rは繰返し上限回数) とする方法, $\|\Delta \mathbf{p}_i\| < \varepsilon$ とする方法,またあらかじ め正解パラメータでの特徴量識別器を学習しておき,

表 1	使用した顔画像データベース

Table 1 Test databases.

	撮影環境	表情	画像枚数
BioID-DB	屋内 , 均一	目や口の開閉	1,521 枚
	照明		
Snap-DB	屋外自然	笑顔を含む様々な表	2,325 枚
	光を含む	情	
	様々な環境		
YaleB-DB	屋内 , 照明	無表情	601 枚(顔向
	変化		き正面のみ)
INC-DB	屋内 , 均一	目を閉じる,口を開	各表情 300 枚
	照明	く等の表情変化(詳	
		細は図 6 に記載)	

この識別器の出力により終了判定する手法等が考えられる.

6. 評価実験

提案手法の性能を評価するための実験を行った.評 価には,公開データベース(DB)である BioID Face Database [9], The Extended Yale Face Database B [10] に加え,我々が独自に収集した表情変化 DB (INC-DB)及びスナップ写真 DB(Snap-DB)を用 い,表情変化や照明の変化に対する性能の比較を行っ た.各 DB の詳細については表1に示した.学習に は,照明(屋外含む),表情,顔向きなどを変化させ て我々が独自に撮影した画像約10,000枚を使用した.

なお我々は,ノイズに対する頑健性や計算の高速性 から,特徴量として Haar-like 特徴量 [5] を用いた.具 体的には,各サンプリング位置で方向,パターンの異 なる数種類の Haar-like 特徴量をサンプリングする. 特徴量が j 種類,サンプリング点数が k のとき,特徴 量次元は jk となる(本実験では j = 6, k = 235).

従来手法の実装プログラムとしては STASM [8] を 使用した.提案手法は Appearance を推定する手法 ではなく,特徴点位置の検出を目的とした手法である ため,前者を目的とした AAM ではなく,後者を目 的とした ASM ベースの手法との性能比較を行った. STASM では,多重解像度画像における法線方向輝度 パターンのマッチングを利用し形状モデルのフィッティ ングを行う.ASAM 及び STASM は C/C++言語を 用いて実装し,PC (PentiumD 3.2 GHz CPU)上で 実行した.まず入力画像に対して顔検出 [11] を行い, 顔方形の中心に平均形状モデルを初期位置として配置 する.その初期位置から ASAM あるいは STASM を 用いた形状モデルのフィッティングを行い,左右の目 尻,目頭及び口の左右端点の計 6 点の位置を検出した.



図 6 提案手法(ASAM)及び従来手法(STASM)によ る検出性能

Fig. 6 Experimental results.

顔器官の端点位置は定義が難しく,入力する人によっても多少のずれが生じる.そこで,正解点を中心として半径が両目間隔の10%の円内に入っているものを正解とした.

図 6 に検出率を示した.検出率については,各器官 における左右の端点の平均値を示した.The Extended Yale Face Database B については,照明に対する影 響を比較するため,顔向き正面の画像のうち,照明角 度が左右20度,上下30度以内のもの(yaleB1)とそ れ以外のもの(yaleB2)に分けて評価を行った.

図より両手法とも,表情変化及び照明変化の少ない DB(INC_F,BioID,yaleB1)においては同程度の検 出率を示している.しかし目を閉じる(INC_EYEC), 口を開ける(INC_MA,MO,MB)といった表情変化 時に従来手法では性能が大幅に低下しているのに対し て,提案手法は安定して高い検出率を示しているのに対し て,提案手法は安定して高い検出率を示していること が分かる.また激しい照明変動を含むDB(yaleB2) に対しては両手法とも大きな性能の低下を示してい るが,提案手法の検出率は従来手法よりも高い値を示 している.また表情変化及び照明変化を複合的に含む Snap-DBに対しても,提案手法が大幅に高い性能を 示している.以上の結果から,提案手法は照明変化に よる影や,表情の変化に対して従来手法と比較して頑 健であるといえる.

また平均処理時間は提案手法が 0.017 (s), 従来手法 が 0.264 (s) であった.提案手法の処理時間は従来手 法の約 20 分の 1 であり, 大幅な高速化が実現できて いる.また形状モデル修正の回数は提案手法が 21 回, 従来手法では 32 回であり, 1 回の形状修正に要する平 均処理時間はそれぞれ 0.81 (ms), 8.25 (ms) であった.



図 7 形状モデルフィッティングの成功例 Fig. 7 Model fitting results.

7.考察

本章では提案手法がもつ,(1)構造的レティナサン プリング,(2)特徴量からの摂動状態推定,それぞれ の処理に関して,検出精度,処理速度に対する効果を 実験結果より考察する.

7.1 構造的レティナサンプリング

影や表情変化によるしわなどのノイズは,フィッティ ングの性能を低下させる要因となる.頬や額など,も ともとはっきりした特徴のない領域の特徴量は,モデ ルの摂動に対して変化が少なく,フィッティングに有効 な情報をもたないことが多い.そのため相対的にノイ ズが主要な変動成分となりやすい.モデル全域を均等 にサンプリングする手法では,こういった領域の特徴 量を多く含むため,ノイズに対して脆弱となりやすい.

それに対して各特徴点周辺の局所的な画像特徴は, ノイズに対してそれほど大きく変化しないことが多い (例えば,鼻の穴は照明変化でも表情変化でも似た特徴 を保つ).しかしながら局所的な特徴だけに着目する と,正解位置からの少しのずれに対してもフィッティ ングが困難になりやすく,また,周辺情報を用いない ため局所解に陥りやすいという課題がある.形状モデ ル全体で特徴点周辺を密にサンプリングする本手法は, 特徴点周辺に比重を置いた特徴量が得られるため影や 表情変化に頑健な性質をもちながら,周辺のサンプリ ングによりずれに対する頑健性を高め,更に形状モデ ル全体の情報を用いることで局所解に陥る危険性を低 減させており,高精度のフィッティングを実現する上 で有効であるといえる.

図7に,表情変化,照明環境の変化を含めた様々な 状態に対するフィッティング結果例を挙げる.提案手 法は笑顔,口を大きく開けるといった表情変化に対し ても頑健にフィッティング可能である.その一方,目



図 8 形状モデルフィッティングの失敗例 Fig. 8 Model fitting failure results.

を強く閉じて顔をゆがめるような表情変化に対しては 失敗することがある.これは,重要な局所情報である 目の特徴が大きく変化してしまうことによって,フィッ ティングが困難になったためと考えられる.同様の理 由により,特徴点周囲の局所特徴を大きく変化させる ような影がある場合や,サングラス・マスク等によっ て目や口が完全に隠れた場合も,フィッティングが困 難となる.失敗したフィッティングの例を図8に示す.

7.2 特徴量からの摂動状態推定

従来手法においては,各ノードでの特徴点探索,形 状モデルの微調整を繰り返しながら徐々に正解に近づ いていくという処理を行うため,比較的長い処理時間 を必要とした.これに対して提案手法によるフィッティ ングでは,各ノード個別での探索が不要であり,特徴 量から一度の行列演算で形状修正を行うことが可能な ため,処理時間を大幅に削減できている.

なお回帰推定により形状修正することは,上述の利 点をもつ反面,摂動状態の推定に失敗した場合,正解 とは別方向に大きく動くことでモデルの摂動が学習範 囲を超え,フィッティングが発散する危険性をもつ.こ れを防止するため,5.3のステップ(4)において十分 小さな重み δ の値を選択し,一度に大きな形状修正が 起こらないようにすることが有効である.しかしなが ら δ を小さい値に設定するとフィッティングに多数の 形状修正が必要となる.現在は徐々に重みの修正を行 いながら性能評価を繰り返し最適値を求めているが, より効率的な重みの設定方法ついては今後検討が必要 である.

また相関の学習に関して,本論文では CCA の例 を示したが, Support vector 回帰, Relevance vector machine 等他の多変量回帰の手法によっても学習は可 能であると考えられる.その際の検出性能の検証は今 後の課題である.

8. む す び

構造的レティナサンプリングと特徴量からの摂動状 態推定による,新たな形状モデルフィッティングの枠 組みを提案した.提案手法は照明変化や表情変化など 様々なノイズに対して頑健な性能を示しながら,従来 手法と比較して大幅な高速化を実現している.今後は より幅広い顔向き,表情変化への対応とともに,サン グラスやマスク等の顔の隠れに対する性能向上が課題 である.これによって,ディジタル画像機器,セキュ リティ機器等でのよりいっそうの活用が期待される. また一方,人体や工業部品等に対して提案手法を適用 することで,これらの対象に対しても高速,高精度な 姿勢推定を実現していくことも今後の課題である.

献

文

- T.F. Cootes, C.J. Taylor, D.H. Cooper, and J. Graham, "Active shape models — Their training and application," Comput. Vis. Image Understand., vol.6, no.1, pp.38–59, 1995.
- [2] T.F. Cootes, G.J. Edwards, and C.J. Taylor, "Active appearance models," Computer Vision - ECCV' 98, vol.II, Freiburg, Germany, 1998.
- [3] D. Cristinacce and T. Cootes, "Facial feature detection using adaboost with shape constraints," Proc. 14th British Machine Vision Conference, pp.231–240, Norwich, England, 2003.
- [4] F. Smeraldi and J. Bigun, "Retinal vision applied to facial features detection and face authentication," Pattern Recognit. Lett., vol.23, pp.463–475, Feb. 2002.
- [5] P. Viola, M. Jones, "Rapid object detection using a boosted cascade of simple features," Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, 2001.
- [6] R. Donner, M. Reiter, G. Langs, P. Peloschek, and H. Bischof, "Fast active appearance model search using canonical correlation analysis," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol.28, no.10, pp.1690–1694, Oct. 2006.
- [7] G. Langs, P. Peloschek, R. Donner, M. Reiter, and H. Bischof, "Active feature models," Proc. 18th International Conference on Pattern Recognition, vol.1, pp.417–420, 2006.
- [8] S. Milborrow, Locating Facial Features with Active Shape Models, Master's thesis, University of Cape Town (Department of Image Processing), 2007.
- [9] O. Jesorsky, K.J. Kirchberg, and R.W. Frischholz, "Robust face detection using the Hausdorff distance," Proc. Third International Conference on Audio- and Video-based Biometric Person Authentication, Springer, Lect. Notes Comput. Sci., LNCS-

2091, pp.90–95, Halmstad, Sweden, June 2001.

- [10] K.-C. Lee, J. Ho, and D. Kriegman, "Acquiring linear subspaces for face recognition under variable lighting," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol.27, no.5, pp.684–698, May 2005.
- [11] T. Yamashita, S. Lao, N. Tabata, H. Saito, and M. Kawade, "A fast omni-directional face detection system," IEEE 10th International Conference on Computer Vision (ICCV 2005), Demo, 2005.
- [12] I. Matthews and S. Baker, "Active appearance models revisited," Int'l J. Computer Vision, vol.60, no.2, pp.135–164, 2004.
- [13] 木下航一,小西嘉典,勞 世広,川出雅人,"3D モデル高 速フィッティングによる顔特徴点検出・頭部姿勢推定"第 11回画像の認識・理解シンポジウム,July 2008.

(平成 22 年 8 月 4 日受付, 11 月 8 日再受付)



木下 航一

平 8 神戸大・工・システム工卒.平 10 同大大学院博士前記課程了.同年オムロン (株)入社.主として画像認識の研究開発 に従事.平 21 画像センシングシンポジウ ム高木賞受賞.



小西 嘉典

平 12 京大・総合人間学卒.平 14 同大 大学院人間・環境学研究科博士前期課程了. 平 17 同研究科博士後期課程指導認定退学. 平 19 オムロン(株)入社.以来,顔画像 認識技術,映像監視技術の研究開発に従事.



勞 世竑

1984 中国浙江大・電気卒.1992 京都大 学工学研究科博士課程中退.同年オムロン (株)入社.コンピュータビジョンの研究に 従事.画像センシングシンポジウム高木賞 受賞.



川出 雅人 (正員)

昭 56 名工大・計測工学卒.同年立石電 機(現オムロン)入社.CAD/CAM/CAE の知能化研究開発に従事,平2米国カー ネギーメロン大訪問研究員,平6日本帰国 後,顔・人の視覚による理解技術の研究に 従事,平20技術戦略立案,技術協創促進,

技術事業化支援の業務に従事.画像センシングシンポジウム高 木賞(平 21)受賞.IEEE 会員.



村瀬 洋 (正員:フェロー)

昭 53 名大・工・電気卒.昭 55 同大大学 院修士課程了.同年日本電信電話公社(現 NTT)入社.平4から1年間米国コロン ピア大客員研究員.平15から名古屋大学 大学院情報科学研究科教授.現在に至る. 文字・図形認識,コンピュータビジョン,マ

ルチメディア認識の研究に従事.工博.昭60本会学術奨励賞, 平6IEEE-CVPR最優秀論文賞,平7情報処理学会山下記念 研究賞,平13高柳記念奨励賞,平13本会ソサエティ論文賞, 平14本会業績賞,平15文部科学大臣賞,平16IEEE Trans. MM論文賞,平22前島賞,他受賞.IEEEフェロー,情報処 理学会会員.